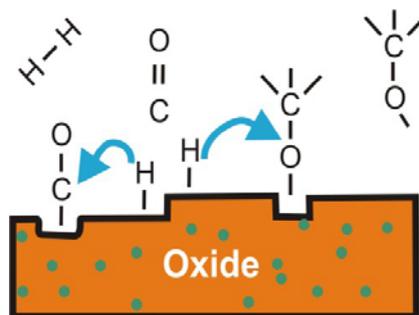


# Ruhr-Universität Bochum



**SFB 558**

## „Metall-Substrat-Wechselwirkungen in der heterogenen Katalyse“

**Einladung  
zum Vortrag von**

**Dr. W. Unger**

**AG Schicht- und Oberflächenanalytik**

**Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM)  
Berlin**

**Thema:**

### **Qualitätssicherung in der Oberflächenanalytik: BAM - Referenzmaterialien und ISO – Normen**

Die Vergleichbarkeit von Analyseergebnissen ist wirtschaftlich und wissenschaftlich ein hohes Gut. Sie kann durch die Validierung von Messverfahren und durch die Herstellung von Rückführungsketten auf anerkannte Referenzen hergestellt werden. Von großer Hilfe sind dabei zertifizierte Referenzmaterialien (CRM). Am Ende pränormativer oder metrologischer Forschung steht ein normiertes und bezüglich der Messunsicherheit qualifiziertes Messverfahren.

Im Vortrag werden zwei aktuelle Referenzmaterialentwicklungen der BAM vorgestellt. Das eine dient der Bestimmung der Ortsauflösung abbildender Oberflächenanalyseverfahren (ToF-SIMS, AES, ESCA, AFM...) im Nanometerbereich, das andere der Verbesserung der quantitativen Elementanalytik mit dem EDX-Verfahren, das weit verbreitet an Elektronenmikroskopen betrieben wird. Die für die Oberflächenanalytik existierenden ISO-Normen und die Wege ihrer Erarbeitung werden ebenfalls dargestellt.

<b>Termin:</b>	<b>17.10.2006</b>
<b>Zeit:</b>	<b>11.15 h</b>
<b>Ort:</b>	<b>HNC 5/99</b>

*Gäste sind herzlich willkommen.*